

- 甲目标辐射特性研究[J]. 西北工业大学学报, 2015, 33(1):135-140.
- [10] 王桂丽, 李兴国. 毫米波交流辐射计成像研究[J]. 仪器仪表学报, 2009, 30(5):1089-1093.
- [11] 冷朋, 赵浩. 微波功率测量中的小信号检测[J]. 国外电子测量技术, 2017, 36(3):67-69.
- [12] 王琦. 射频与微波开关系统的设计与应用[J]. 国外电子测量技术, 2015, 34(5):12-14.
- [13] 刘虎, 赵建洋, 周蕾. 基于斩波时域积分射频导纳物位

仪研究与设计[J]. 电子测量与仪器学报, 2014, 28(9):1005-1012.

作者简介

王贺涛, 1991年出生, 工学硕士, 主要研究方向为仪器与测量技术、图像处理与识别等。
E-mail: 960812950@qq.com

《2018 NI 趋势展望报告》与您一起探索驱动未来加速到来的力量

NI 提供了对机器学习、物联网(IoT)、5G 以及车辆电气化等领域主流趋势的见解

2017年10月26日, NI(美国国家仪器公司, National Instruments, 简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供基于平台的系统解决方案来应对全球最严峻工程挑战的供应商, 今日发布了《2018 NI 趋势展望报告》, 探讨技术的进步正以前所未有的速度推动我们奔向未来, 预言2018年工程师将面临的重大挑战。

“迈入21世纪, 我们的客户不断要求更高质量的设备、更快速的测试、更可靠的网络以及近乎实时的计算来帮助企业持续向前发展。”NI 企业营销副总裁 Shelley Gretlein 表示: “NI 不仅探索影响行业未来的趋势帮助客户与时俱进, 并基于以软件为中心的开放平台提供可行的洞察和建议, 帮助客户加速自定义测试、测量和控制系统的开发。”

《2018 NI 趋势展望报告》探讨了以下主题:

1) **机器学习让数据为您工作**-智能系统会产生数据并依赖于数据, 数据量的不断增加加剧了对大模拟数据(Big Analog Data™)的挑战。了解机器学习如何帮助工程师解决面对面的问题, 专注于探索和应对下一个重大挑战。

2) **5G 将颠覆测试过程**-5G 创新不止于设计。测试和测量解决方案将成为产品商业化周期中的关键环节, 但是5G 需要的测试方法与之前的无线技术截然不同。了解哪

些技术正在让5G 逐步变成现实。

3) **IIoT 的3大准则**-工业物联网(IIoT)中智能设备和互联设备的数量快速增加, 为提高性能和降低成本提供了巨大的机会, 但一个被忽视的挑战是如何高效地管理这些分布式系统。查看成功管理IIoT 设备的3大准则。

4) **电气化的影响**-汽车电气化趋势不只是全球从内燃机汽车和混合动力汽车向全电动汽车的转变。除了车辆本身日益复杂的影响, 还需要考虑对支持基础设施提出的新要求。

5) **打破摩尔定律**-尽管最近关于摩尔定律消亡的言论很多, 实际情况与摩尔定律也有所偏差, 但数十年的创新基本上还是一直遵循着摩尔定律。但现在, 这个经过50多年验证的定律再次面临挑战。了解这一现状如何影响半导体市场的未来发展。

访问 www.ni.com/trend-watch, 查看完整的报告。

Big Analog Data、National Instruments、NI 和 ni.com 均为美国国家仪器有限公司(National Instruments)的商标。此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。